

MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

FABRICANT : Digital Instruments

MODÈLE : Dimensions 3100

Échantillons

- Taille d'échantillons : maximum 101 mm (4")
- Épaisseur : maximum 12.7 mm (0.5")
- Géométrie ouverte

Analyses

- Modes : contact, contact intermittent (Tapping), microscopie à force latérale (LMF), microscopie à force magnétique (MFM), microscopie à effet tunnel (STM)
- Mesures topographiques : quantitatif
- Mesure de propriétés viscoélastique : qualitatif
- Cartographie possible : oui
- Résolution latérale : 2 nm

Applications

- Mesures en milieu ambiant ou liquide de la topographie
- Mesures des propriétés mécaniques
- Mesures de friction
- Mesures de rugosité
- Mesures de gradient de champs magnétique
- Mesures de gradient de champs électrique
- Mesures de force d'interaction pointe/surface